

J-PARC E31実験における後方散乱 陽子飛跡検出器の設計開発と Geant4 Simulation

井上謙太郎、野海博之、味村周平、榎本瞬、川崎信吾
早野龍五^A、鈴木隆敏^A、藤原裕也^A、橋本直^A
岩崎雅彦^B、飯尾雅実^B、應田治彦^B、大西宏明^B、板橋健太^B
佐久間史典^B、塚田暁^B、徳田真^C、康寛史^C
永江知文^D、佐田優太^D、石黒洋輔^D、平岩聰彦^D、藤岡宏之^D
石元茂^E、関本美知子^E、豊田晃久^E
谷田聖^F、H.Bhang^F、S.Chi^F、石渡智一^G、M.Cargnelli^G、P.Kienle^G
岡田信二^I、C.Curceanu^I、C.Guaraldo^I、A.Romero Vidal^I
D.Sirghi^I、F Sirghi^I、O.Vazquez Doce^I

阪大RCNP、東大理^A、理研^B、東工大理工^C、京大理^D、KEK/J-PARC^E
ソウル国立大^F、SMI^G、ミュンヘン工大^H、INFN-LNF^I

目次

- Introduction
- J-PARC E31実験のGeant4 Simulation
- 後方散乱陽子飛跡検出器の設計
- 後方散乱陽子検出器による検出効率の改善
- 後方散乱陽子飛跡検出器の製作
- まとめと今後
- 連絡先

$\Lambda(1405)$

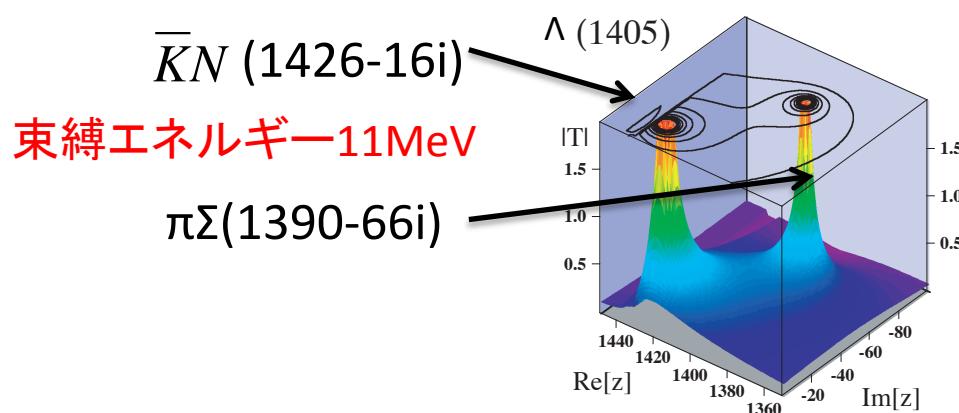
$S=-1, I(J^P)=0(1/2^-)$ のバリオン
負parityでストレンジのない $N^*(1535)$ より軽い



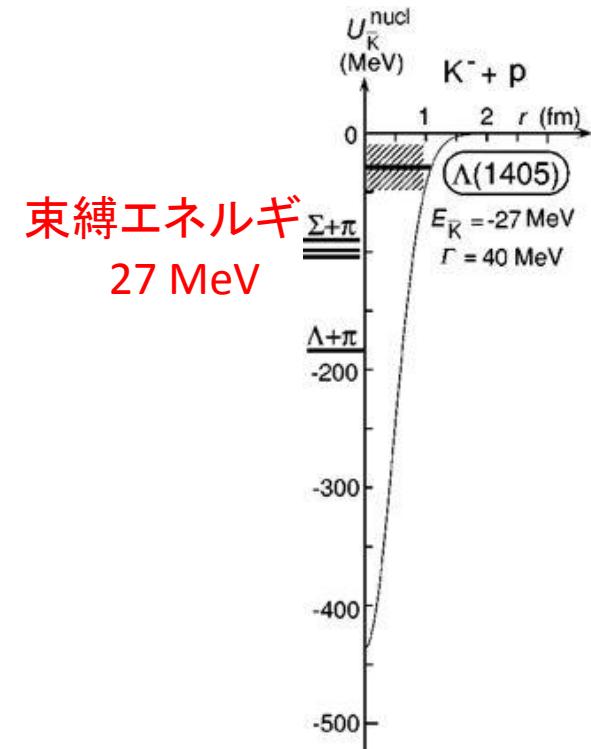
3クオークの状態

or

メソンバリオンの共鳴状態
 $\bar{K}N$ の強い束縛状態(?)
 $\bar{K}N$ と $\pi\Sigma$ 二つの極の重ね合わせ(?)



兵藤らによる
カイラルユニタリー模型での計算



赤石、山崎らによる深い束縛

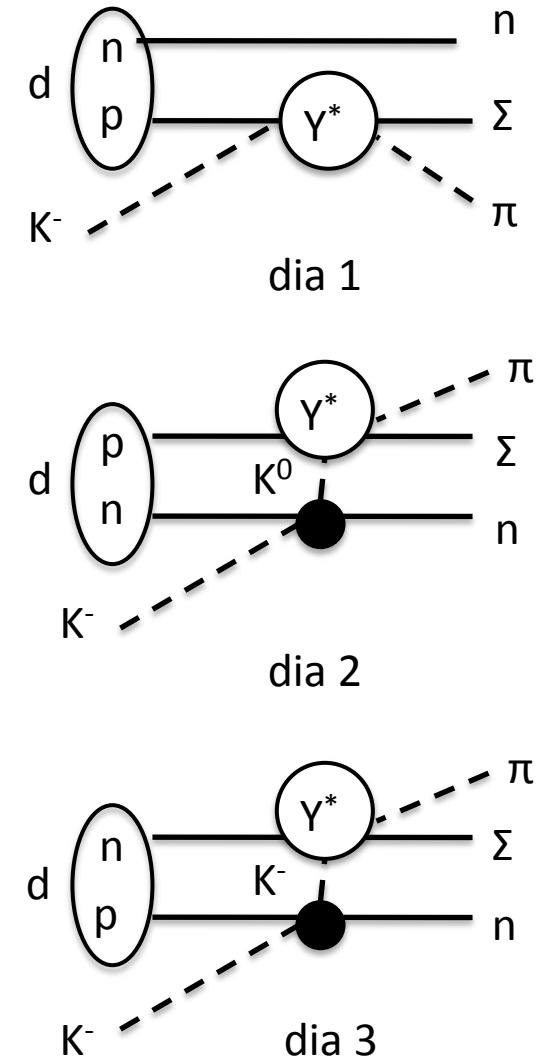
$d(K^-, n)$ 反応

$\Lambda(1405)$ はメソンバリオン $\bar{K}N$ からの説明が試みられている



$\bar{K}N$ から直接 $\Lambda(1405)$ を生成する
 $\Lambda(1405)$ は $\bar{K}N$ 閾値以下
自由空間で直接 $\Lambda(1405)$ に束縛しない
 $d(K^-, n)$ 反応を用いた散乱実験

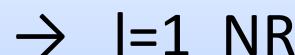
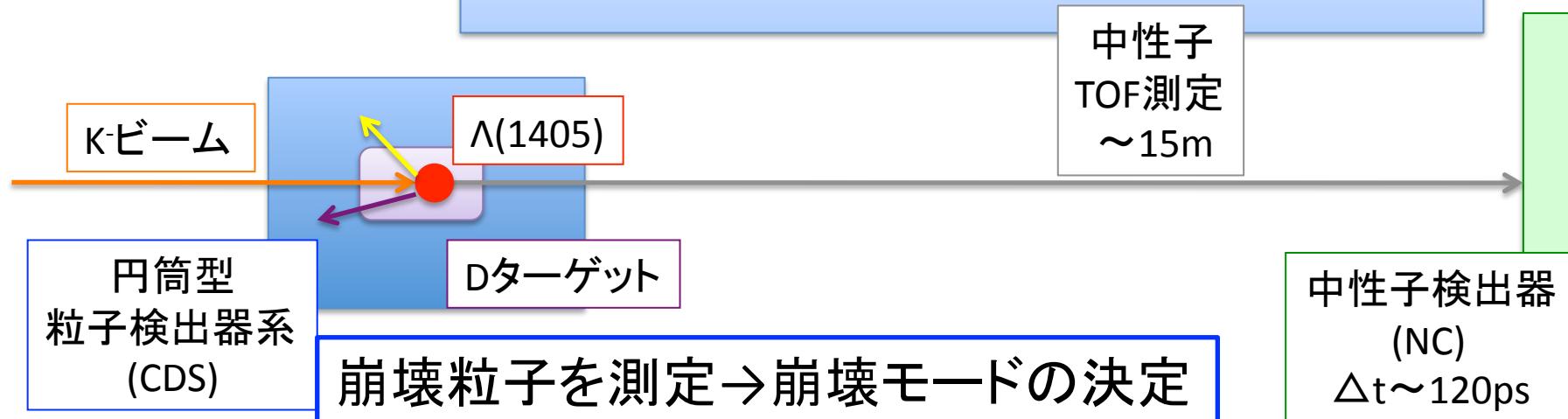
$d(K^-, n)$ の反応チャンネル
S-wave, $l=0 \Lambda(1405)$
S-wave, $l=1$ non-resonant
P-wave, $l=1 \Sigma(1385)$



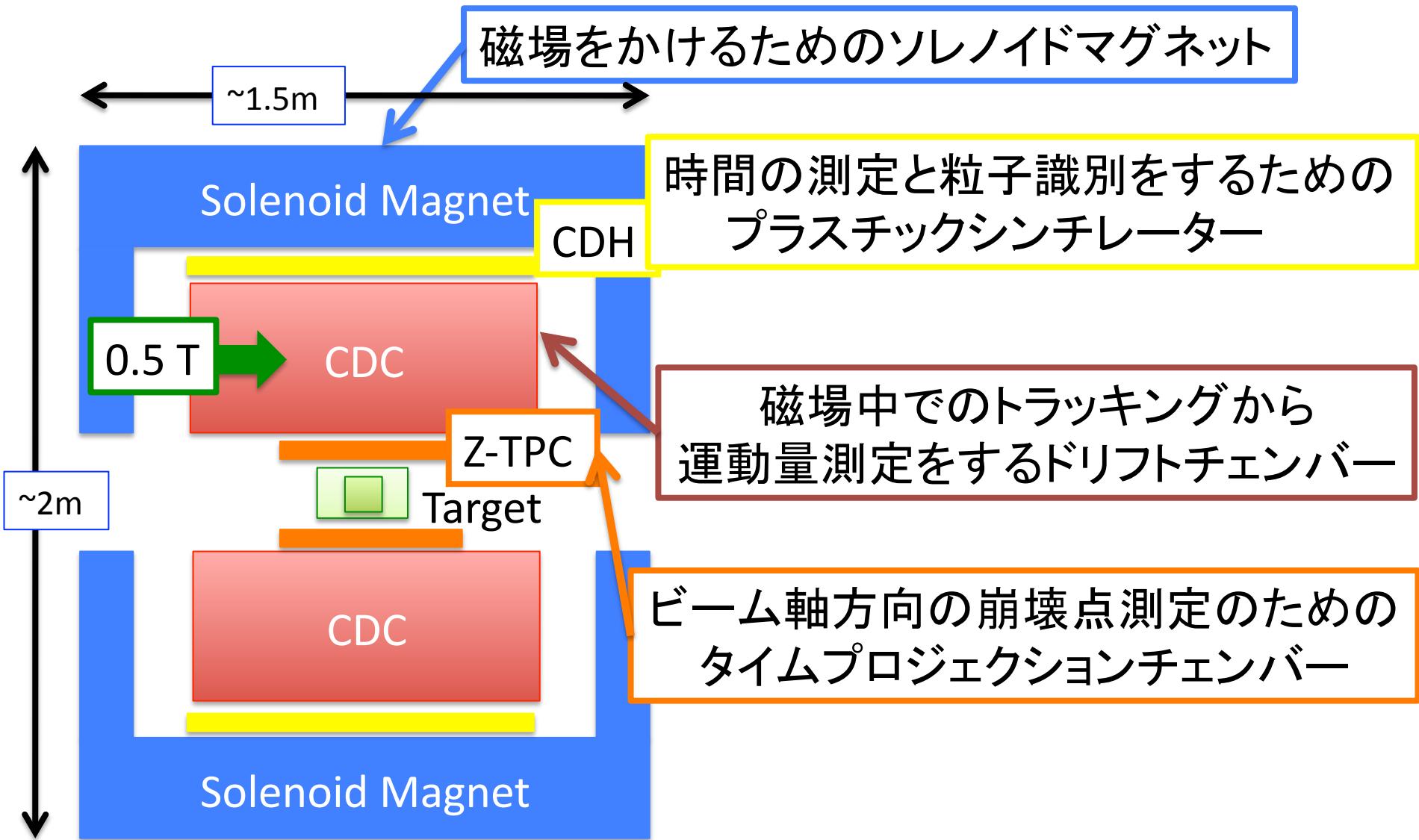
J-PARC E31実験

欠損質量法より $\Lambda(1405)$ の質量を測定する

$$MM_{hyperon} = \sqrt{(P_{k^-} + P_n + P_D)^2}$$



CDS(円筒型崩壊粒子検出器系)



Geant4によるSimulation

目的

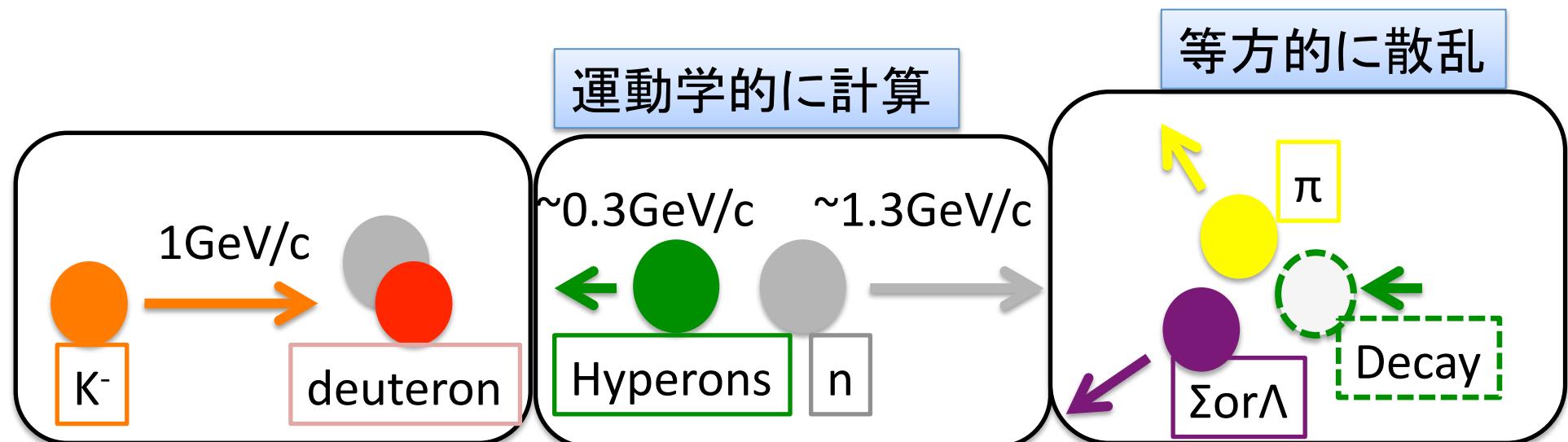
各崩壊モードの特定し検出効率と混入率を見積もる

(検出効率)=(有効なイベント数)/(崩壊モードの全イベント数)

(混入率) =(他のモードに混入した数)/(崩壊モードの全イベント数)

イベントの発生

生成されるハイペロンの質量を $1340\sim 1540\text{MeV}/c^2$ の一様乱数
崩壊モードは $\pi^- \Sigma^+ : \pi^0 \Sigma^0 : \pi^+ \Sigma^- : \pi^0 \Lambda = 1:1:1:1$



崩壊モード

- $\Lambda(1405)[\Sigma(1385)] \rightarrow \pi^+ \Sigma^- \rightarrow \pi^+ (\textcolor{red}{n} \pi^-)$
- $\Lambda(1405)[\Sigma(1385)] \rightarrow \pi^- \Sigma^+ \rightarrow \pi^- (\textcolor{red}{n} \pi^+)$
- $\Lambda(1405)[\Sigma(1385)] \rightarrow \pi^- \Sigma^+ \rightarrow \pi^- (\textcolor{blue}{p} \pi^0)$
- $\Lambda(1405) \rightarrow \pi^0 \Sigma^0 \rightarrow \pi^0(\gamma \Lambda) \rightarrow \pi^0 \gamma (\textcolor{blue}{p} \pi^-)$
- $\Sigma(1385) \rightarrow \pi^0 \Lambda \rightarrow \pi^0 (\textcolor{blue}{p} \pi^-)$

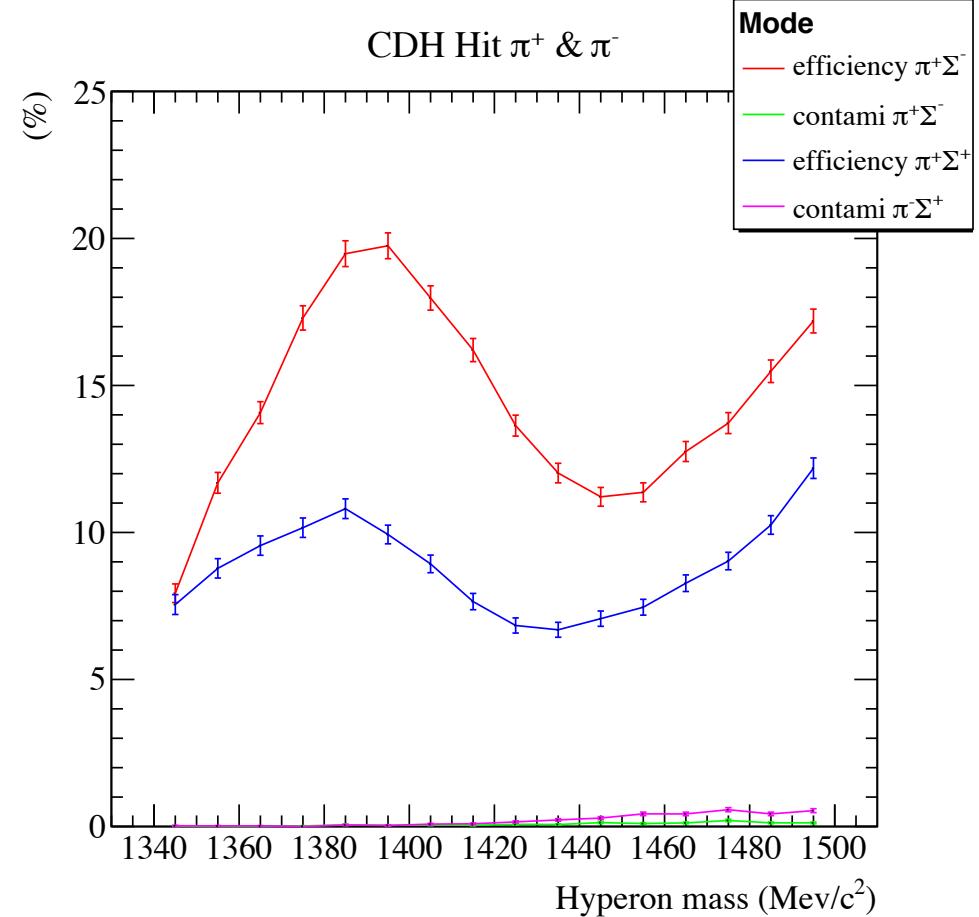
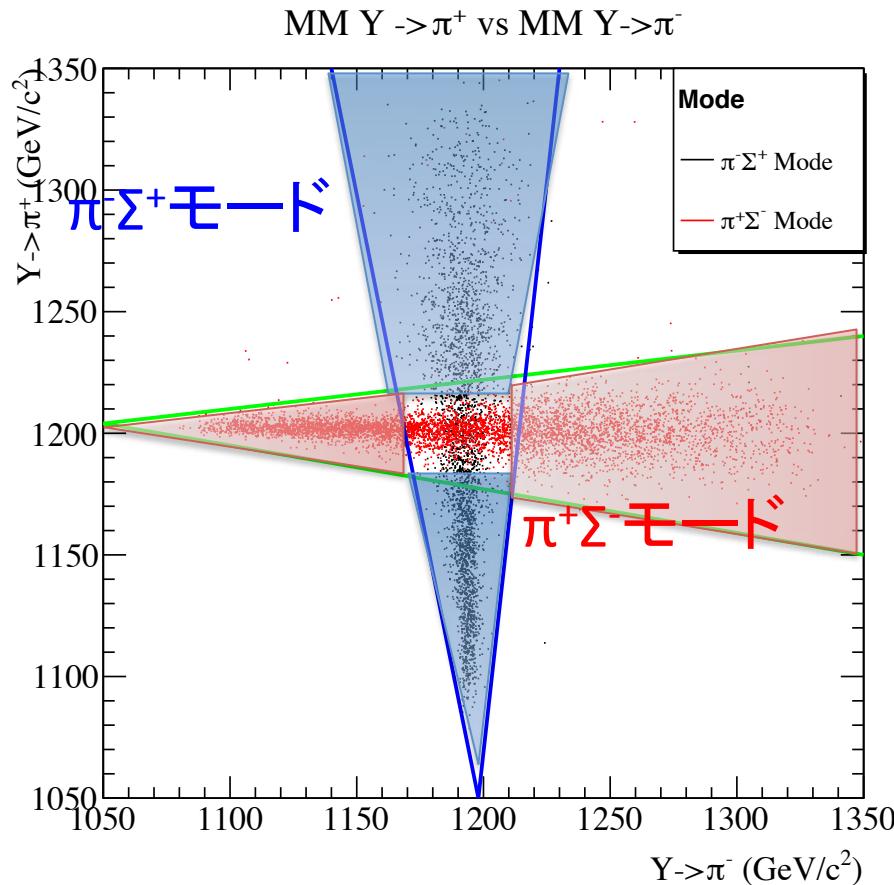
検出できるのは荷電粒子だけ
終状態として π^+ 、 π^- と p 、 π^- が検出されるパターンがある
崩壊モードの特定はこれらの
不変質量、欠損質量などから決定する

崩壊モードの特定($\pi^+\pi^-$ 終状態)

- $\Lambda(1405)[\Sigma(1385)] \rightarrow \pi^+ \Sigma^- \rightarrow \pi^+ (n\pi^-)$
- $\Lambda(1405)[\Sigma(1385)] \rightarrow \pi^- \Sigma^+ \rightarrow \pi^- (n\pi^+)$

| $\pi^+\pi^-$ 終状態 | $\Upsilon \rightarrow \pi^+$ Missing Mass | $\Upsilon \rightarrow \pi^-$ Missing Mass |
|-----------------------|---|---|
| $\pi^+\Sigma^-$ 崩壊モード | Σ^- | Not Σ^+ |
| $\pi^-\Sigma^+$ 崩壊モード | Not Σ^- | Σ^+ |

崩壊モードの特定($\pi^+\pi^-$ 終状態)



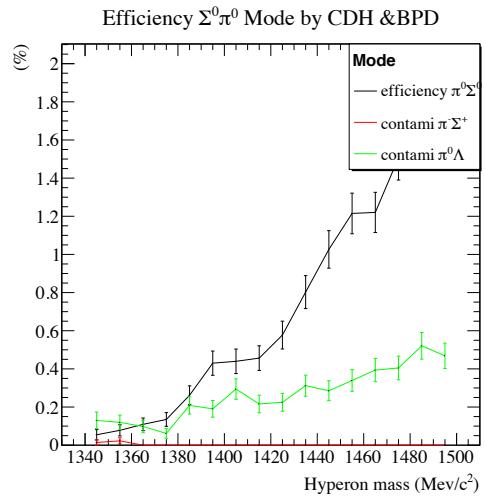
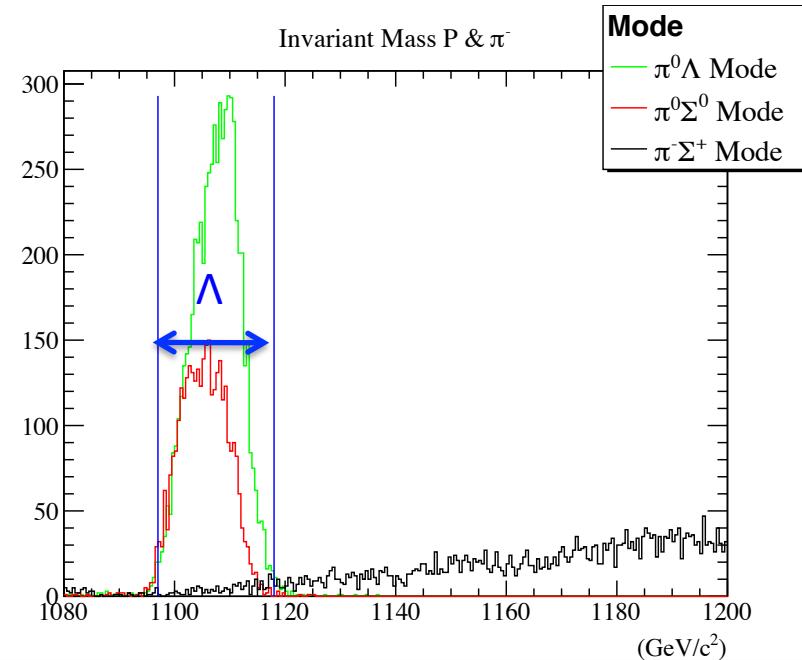
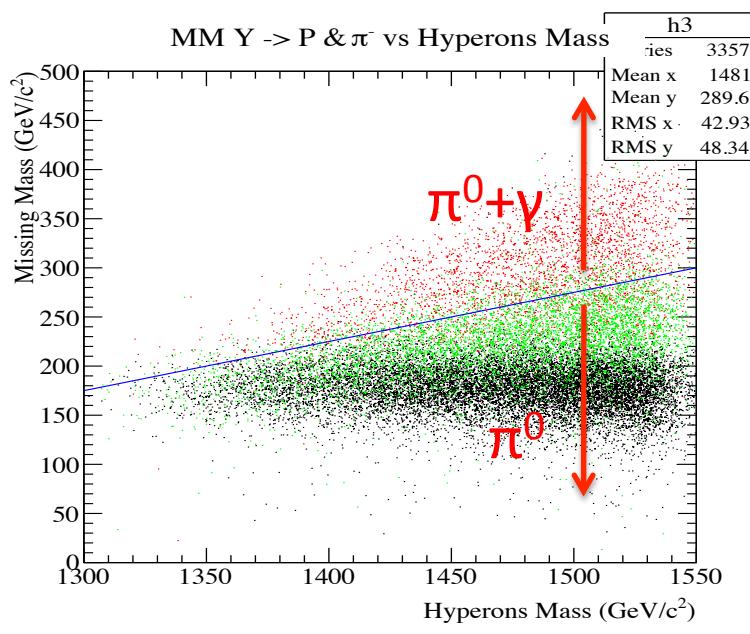
検出効率に対して十分低い混入率

崩壊モードの特定(π^- , P 終状態)

- $\Lambda(1405)[\Sigma(1385)] \rightarrow \pi^- \Sigma^+ \rightarrow \pi^- (\text{p } \pi^0)$
- $\Lambda(1405) \rightarrow \pi^0 \Sigma^0 \rightarrow \pi^0(\gamma \Lambda) \rightarrow \pi^0 \gamma (\text{ p} \pi^-)$
- $\Sigma(1385) \rightarrow \pi^0 \Lambda \rightarrow \pi^0 (\text{ p} \pi^-)$

| p π^- 終状態 | p π^- Invariant mass | $\Upsilon \rightarrow p \pi^-$ missing mass |
|----------------------|--------------------------|---|
| $\pi^- \Sigma^+$ モード | Not Λ | π^0 |
| $\pi^0 \Sigma^0$ モード | Λ | $\pi^0 + \gamma$ |
| $\pi^0 \Lambda$ モード | Λ | π^0 |

$\pi^0\Sigma^0$ モードの特定



1400MeV/c²付近での混入率が
検出効率に対して高い

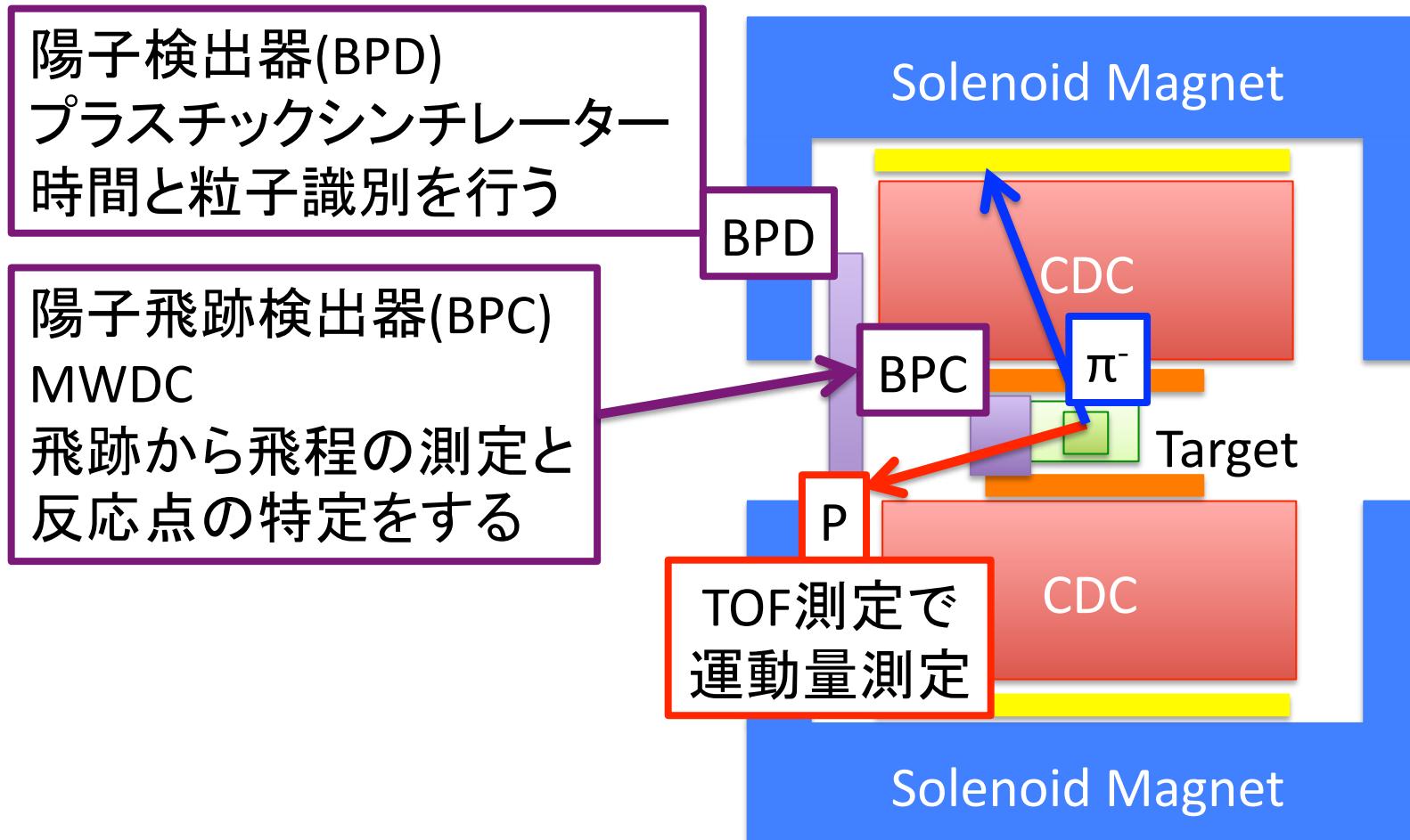


$\pi^0\Sigma^0$ モードが分離できない

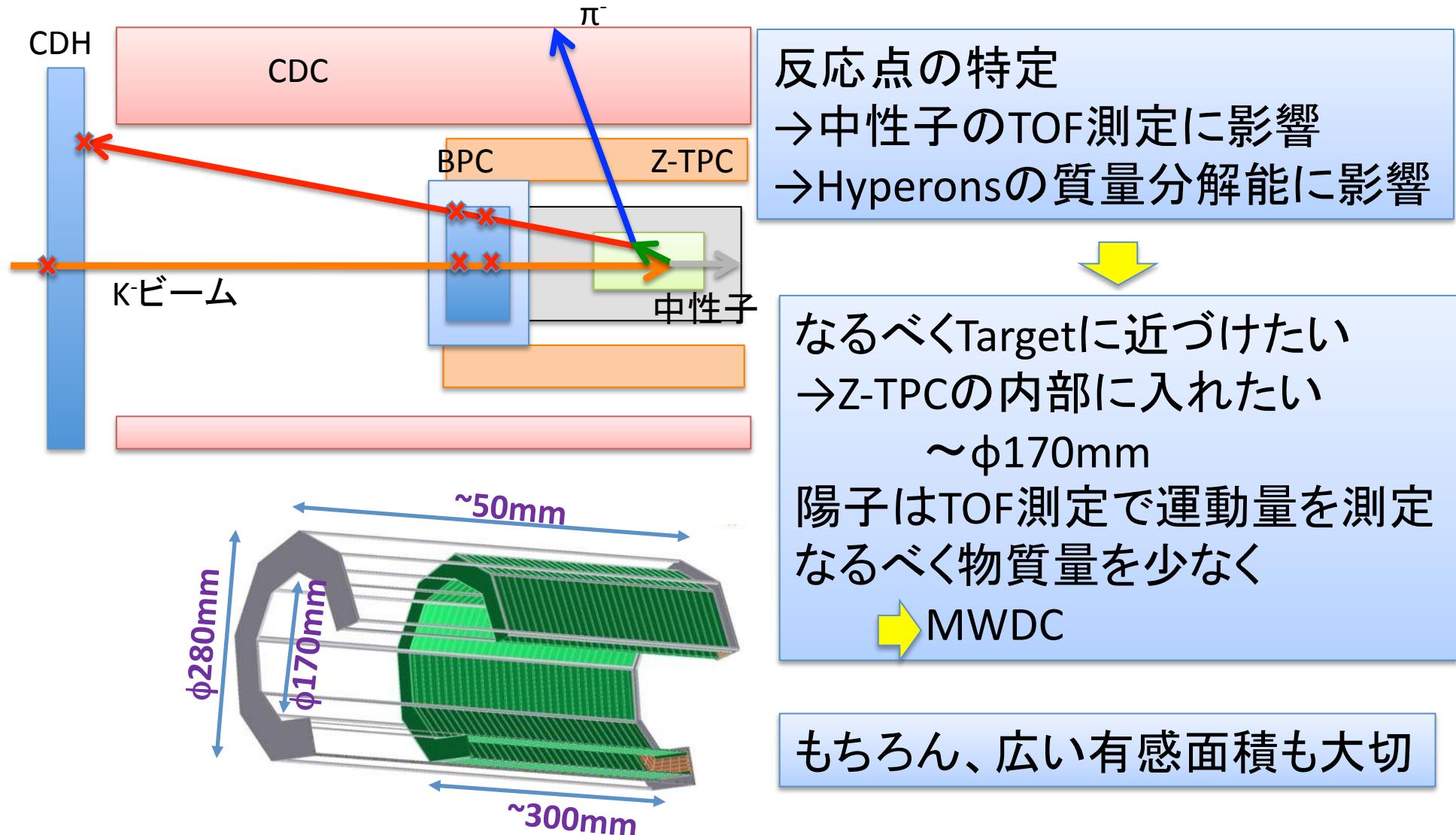
後方に散乱される陽子の検出が重要!

後方散乱陽子検出器系

- 後方に散乱される粒子(陽子)をカバーする

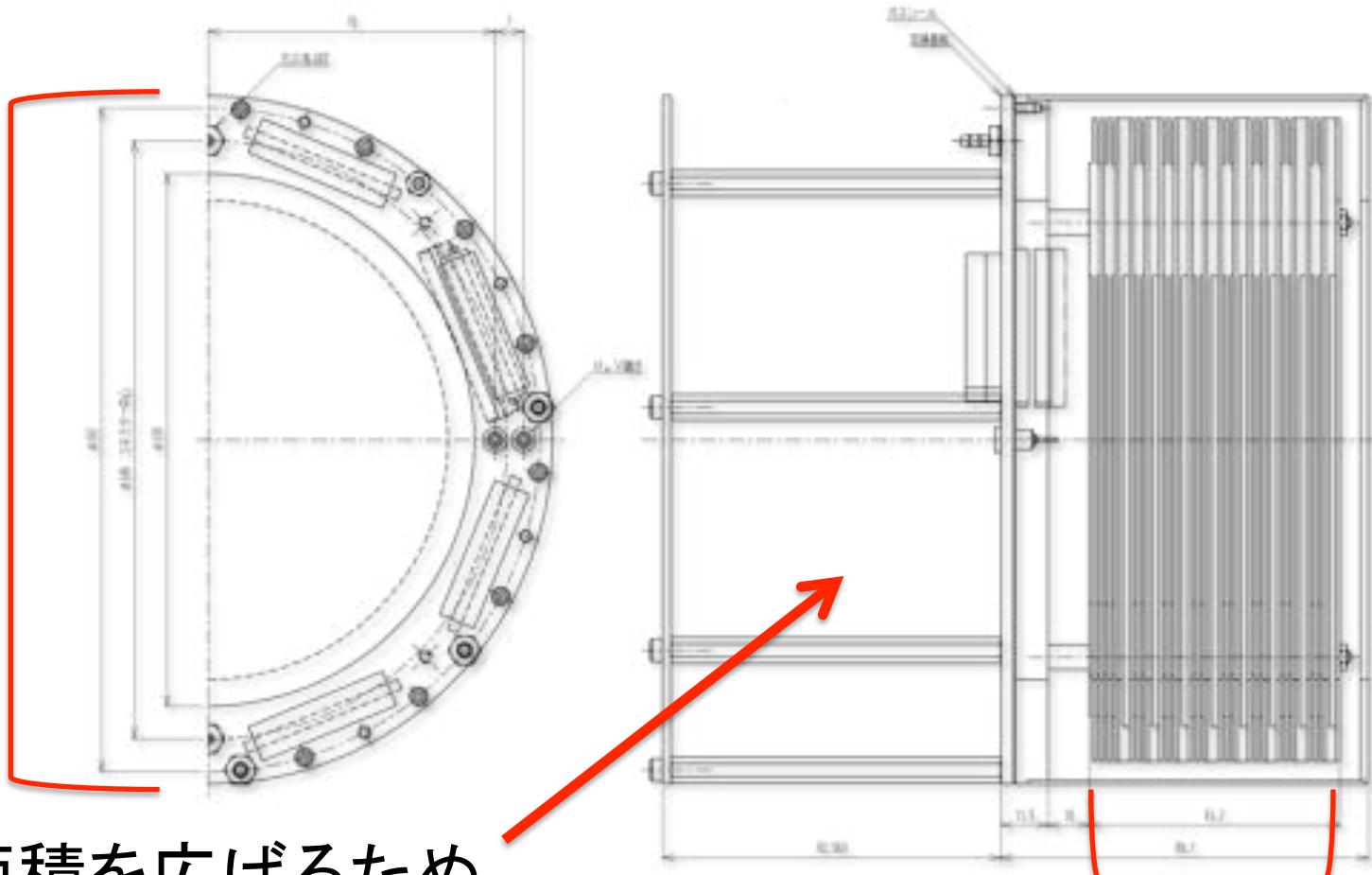


陽子飛跡検出器(BPC)への要求



陽子飛跡検出器(BPC)の設計

外径:Φ168mm



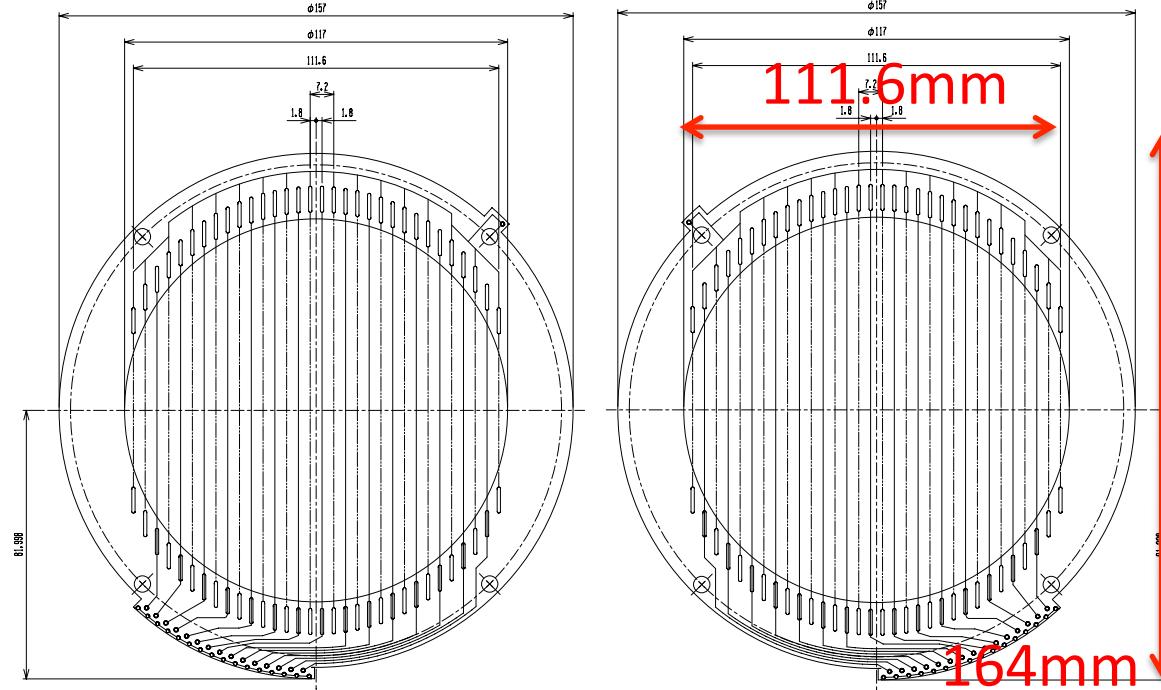
有感面積を広げるため
読み出し部分を後方に配置

アノード面 × 8面
カソード面 × 9面

面間距離 $3.6\text{mm} \times 17 = 61.2\text{mm}$

XX'YY'XX'YY'計8面

陽子飛跡検出器(BPC)の設計(基盤)

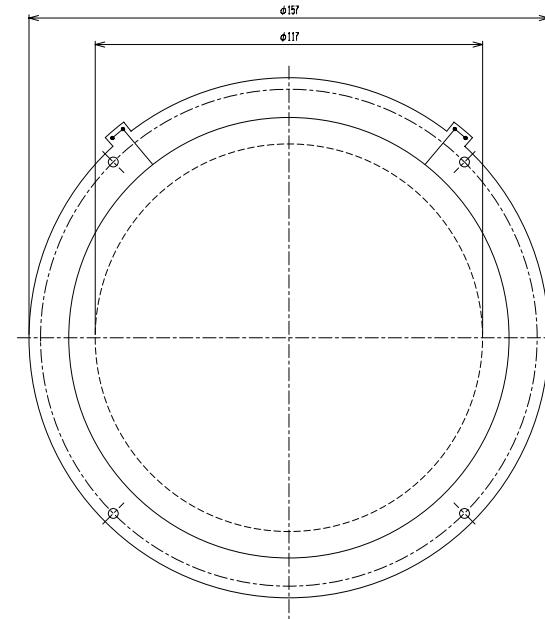


センスワイヤー
Au-W $\phi 12.5\mu\text{m}$
потенциシャルワイヤー
Cu-Be $\phi 50\mu\text{m}$

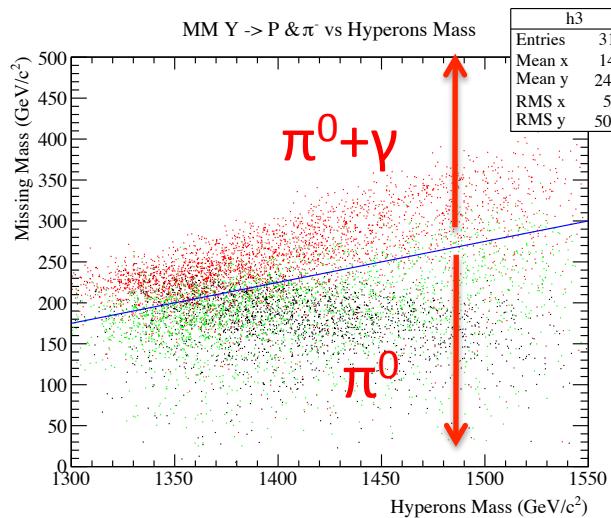
カソード面
カーボンアラミド $9\mu\text{m}$

アノード面 2パターン
外径 $\phi 164\text{mm}$ (チャンバー外径 168mm)
ワイヤー間隔 3.6 mm センスワイヤー 15本

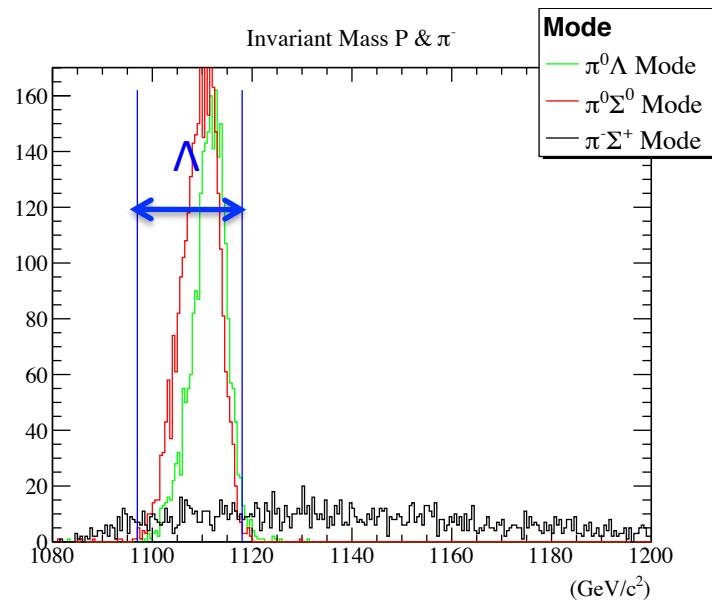
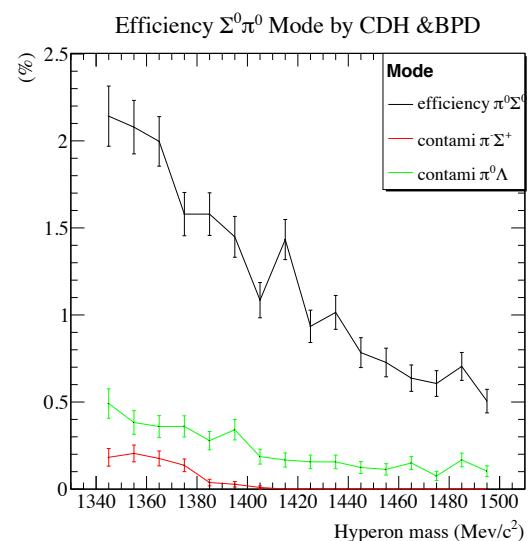
$$3.6\text{mm} \times 7.2 = 115.2\text{mm} \text{ の有感面積}$$



後方散乱陽子検出による $\pi^0\Sigma^0$ モード識別の改善



π^- はCDHで検出
PはBPD&BPCで検出する



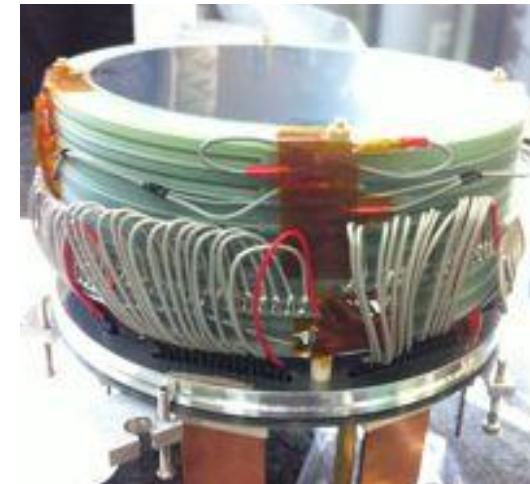
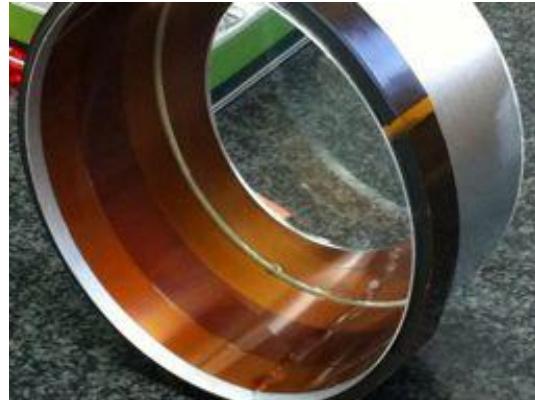
1400MeV/c²付近での
(混入率)/(検出効率)が改善

BPCの製作

外観



内部



放電対策としてポリミドでシールド

空気中で1800Vまで印可
P10(Ar90% エタン10%)ガス中で
1400Vまで印可
1400V以上でトリップ(0.1μA)

信号の測定

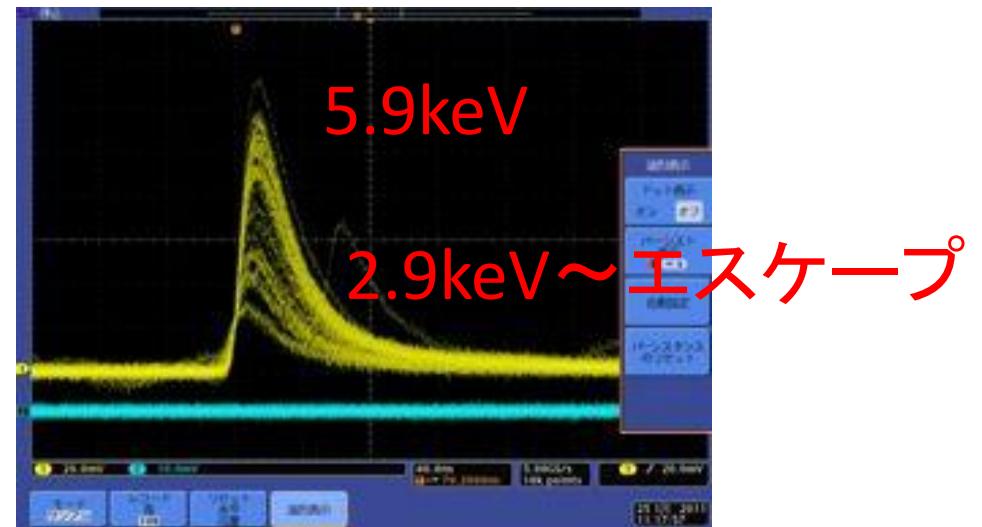
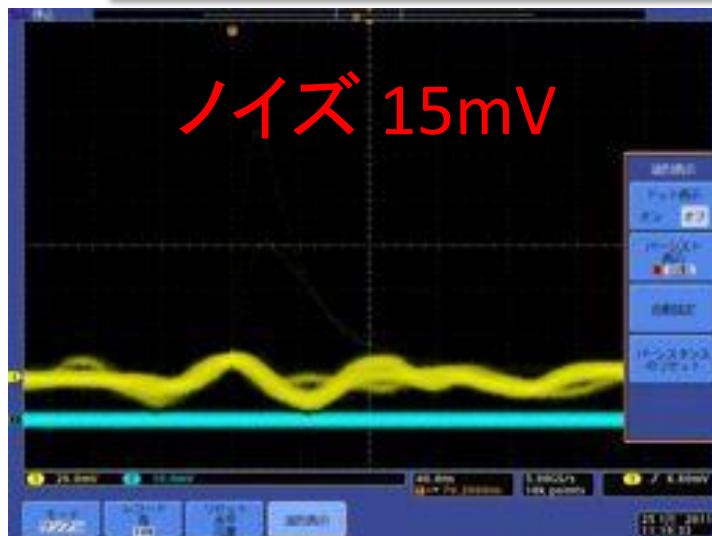
^{55}Fe 線源

X線 5.9keV

エスケープピーク 2.9keV

HV 1300V

ASD アナログアウト



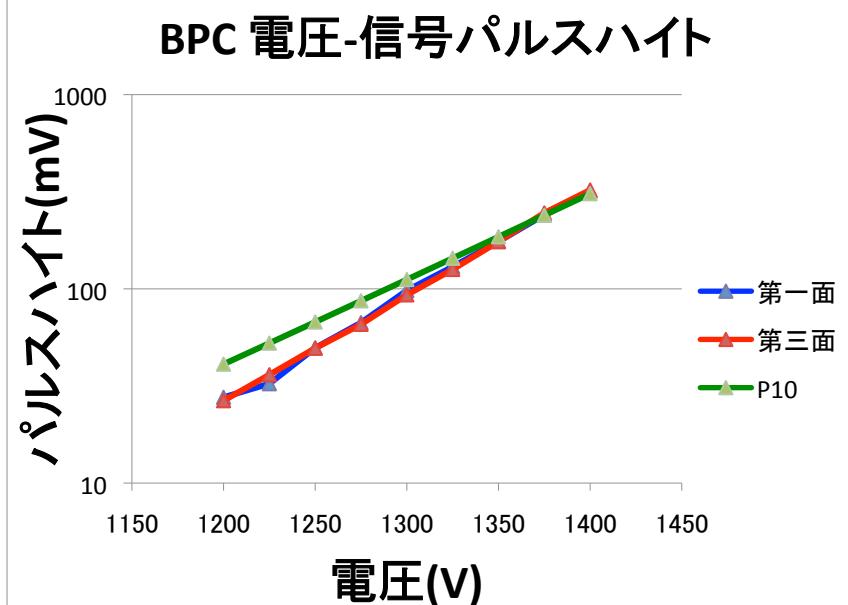
Gainの測定

Fe⁵⁵線源の5.9keVのピークをオシロスコープで測定
HVを1200～1400Vまで25V刻みに測定
第1面、第3面の一本のワイヤーを測定

GarFieldでガスゲインを
シミュレーション

生成されるイオンペアの数
 $5600/26 = 227$

ASDのGain $\sim 0.3\text{V/pC}$



シミュレーションとほぼ同じGainがえられた
面によるGainは見られなかった

まとめ

- Geant4 SimulationによりE-31実験の検出効率と混入率を見積もった
- $\pi^0\Sigma^0$ モードの特定のために後方散乱陽子検出用の飛跡検出器を設計しSimulationにより(混入率)/(検出効率)が低いことを確認した
- 後方散乱飛跡検出器を製作しGainを測定しSimulationと大きな違いがないことを確認した

今後

- Efficiency caveを測定しワイヤー同士のGainの違いを確認する
- ビームテストにより分解能を測定する

連絡先

- ご質問等がありましたら下記までご連絡ください
- 大阪大学 理学研究科
核物理研究センター
野海研究室
kentaro@rcnp.osaka-u.ac.jp
- 最後までお読み下さってありがとうございます